Содержание	Кривулин Д.О., Пашенькин И.Ю., Горев Р.В., Юнин П.А., Сапожников М.В., Грунин А.В., Захаро- ва С.А., Леонтьев В.Н.
	Влияние радиационного воздействия на магнитные свойства пленок ферромагнетик/IrMn с обменным сдвигом (07) 907
	• Физика низкоразмерных структур
XXVII Международный симпозиум "Нанофизика и наноэлектроника" Н. Новгород, 13–16 марта, 2023 г.	Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Морозова А.С., Нурга- зизов Н.И., Чукланов А.П.
• Теоретическая и математическая физика	Использование сканирующей зондовой литографии для формирования планарных микрочастиц с конфигурационной анизотропией (08)
Горай Л.И., Шаров В.А., Мохов Д.В., Березовская Т.Н., Шубина К.Ю., Пирогов Е.В., Дашков А.С., Буравлев А.Д.	Петров Ю.В., Гогина О.А., Вывенко О.Ф.,, Kovalchuk S., Bolotin K.
Кремниевые решетки с блеском для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения: влияние формы профиля штриха и случайной шероховатости	Влияние комбинированного ионного и электронного облучения на полосу люминесценции $2\mathrm{eV}$ в гексагональном нитриде бора (08)
на дифракционную эффективность (01) 859	Божко С.И., Ксенз А.С., Фокин Д.А., Ионов А.М.
Гайкович К.П., Малышев И.В., Реунов Д.Г., Чхало Н.И.	Квантовые эффекты при формировании двойниковой границы в Рb (08)
Теория аксиальной томографии на основе обратного преобразования Радона для высокоапертурной мягкой рентгеновской микроскопии (01)	Шапошников Р.А., Гарахин С.А., Дуров К.В., Пол- ковников В.Н., Чхало Н.И.
	Исследование свойств многослойных зеркал на основе пары материалов Мо/B ₄ C (08)
• Плазма	Ильина М.В., Рудык Н.Н., Соболева О.И., Полывя-
Самохвалов А.А., Сергушичев К.А., Елисеев С.И.,	нова М.Р., Хубежов С.А., Ильин О.И.
Бронзов Т.П., Большаков Е.П., Гетман Д.В., Смирнов А.А.	Исследование влияния температуры роста на свойства легированных азотом углеродных нанотрубок для создания
Исследование эмиссионного спектра быстрого капиллярного разряда в области "водяного окна" (04) 880	устройств нанопьезотроники (08)
Fire Commence & F.H. Barrer and A.B. Harrer	Николенко А.Д.
Преображенский Е.И., Водопьянов А.В., Нежданов А.В.	Короткопериодные многослойные зеркала для высокоразрешающего монохроматора многослойное зерка-
Исследование процесса гидрогенизации одностенных углеродных нанотрубок с помощью индукционно-связанной аргон-водородной плазмы (04)	ло/кристалл (08)
иргон водородной плизим (от)	• Фотоника
Лопатин А.Я., Лучин В.И., Нечай А.Н., Перека-	M
лов А.А., Пестов А.Е., Салащенко Н.Н., Соловыев А.А., Цыбин Н.Н., Чхало Н.И.	Митрофанов А.В., Фещенко Р.М. О численном моделировании трековых мембран, использу-
Эмиссионные характеристики лазерно-плазменного источ-	емых в качестве коллиматоров рентгеновского излучения
ника экстремального ультрафиолетового излучения с тон- копленочными мишенями (04)	(09)
Robbito massin simmentali (07)	Артюков И.А., Арутюнов Г.П., Драгунов Д.О., Мельник Н.Н., Панэке Д.Х.А., Переведенцева Е.В., Со-
• Физическое материаловедение	колова А.В., Соколова В.В.
Ломов А.А., Захаров Д.М., Тарасов М.А., Чекуш- кин А.М., Татаринцев А.А., Киселёв Д.А., Ильи- на Т.С., Селезнев А.Е.	Методы рентгеновского флуоресцентного микроанализа и спектроскопии комбинационного рассеяния света для исследования гистологических срезов мышечных тканей (09)
Влияние гомобуферного слоя на морфологию, микроструктуру и твердость пленок Al/Si(111) (06) 897	Волков П.В., Семиков Д.А., Вязанкин О.С., Горю- нов А.В., Лукьянов А.Ю., Тертышник А.Д.
	Метод детектирования малых колебаний на основе го-
• Твердотельная электроника	модинной демодуляции с тандемным низкокогерентным интерферометром (09)

858 Содержание

Малышев И.В., Михайленко М.С., Пестов А.Е., Торопов М.Н., Чернышев А.К., Чхало Н.И. Внеосевой асферический коллектор для экстремальной ультрафиолетовой литографии и мягкой ренттеновской микроскопии (09)	Логинов Б.А., Блинников Д.Ю., Второва В.С., Кириллова В.В., Ляшко Е.А., Макеев В.С., Первых А.Р., Абросимова Н.Д., Забавичев И.Ю., Пузанов А.С., Волкова Е.В., Тарасова Е.А., Оболенский С.В. Особенности трансформации микрорельефа структур "кремний на изоляторе"при воздействии фотонных и кор-
Венедиктов И.О., Ковалюк В.В., Ан П.П., Голи- ков А.Д., Святодух С.С., Гольцман Г.Н. Исследование направленных ответвителей для реализации	пускулярных излучений (13)
квантовых операций над кубитами (09)	ва Д.В., Малышев И.В., Чхало Н.И. Подложки для мягкой рентгеновской микроскопии на основе Si ₃ N ₄ мембран (<i>13</i>)
на эффективность сверхпроводникового однофотонного детектора (09)	Нанесение жидкого стекла на подложки оптических элементов и его молекулярный состав (13) 1037 Михайленко М.С., Пестов А.Е., Чернышев А.К.,
Малышев И.В., Чхало Н.И., Якунин С.Н.	Зорина М.В., Чхало Н.И., Салащенко Н.Н.
Проект рентгенооптической схемы литографа с динамической маской пропускающего типа и синхротронным источником излучения (09)	Изучение влияния энергии ионов неона на шероховатость поверхности основных срезов монокристаллического кремния при ионном травлении (13)
	Михайленко М.С., Пестов А.Е., Чернышев А.К.,
• Радиофизика	Чхало Н.И.
T	Изучение угловых зависимостей скоростей ионно-
Шитов С.В.	пучкового распыления металлов для синтеза заготовок фотошаблонов (13)
Активный сверхпроводящий терагерцовый детектор (11) 988	фотошаолонов (13)
Ким Т.М., Меренков А.В., Ермаков Ан.Б., Солома- тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В.	• Физические приборы и методы эксперимента
	• Физические приборы и методы эксперимента Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES-	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К.
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении
тов Л.С., Чичков В.И., Шитов С.В. Устройства и методы измерения параметров RFTES- болометра (11)	Приходько К.Е., Дементьева М.М. Применение просвечивающей электронной микроскопии для исследования функционального наноэлемента (15) . 1054 Дедкова А.А., Флоринский И.В., Чернышев А.К. Использование морфометрических величин при изучении